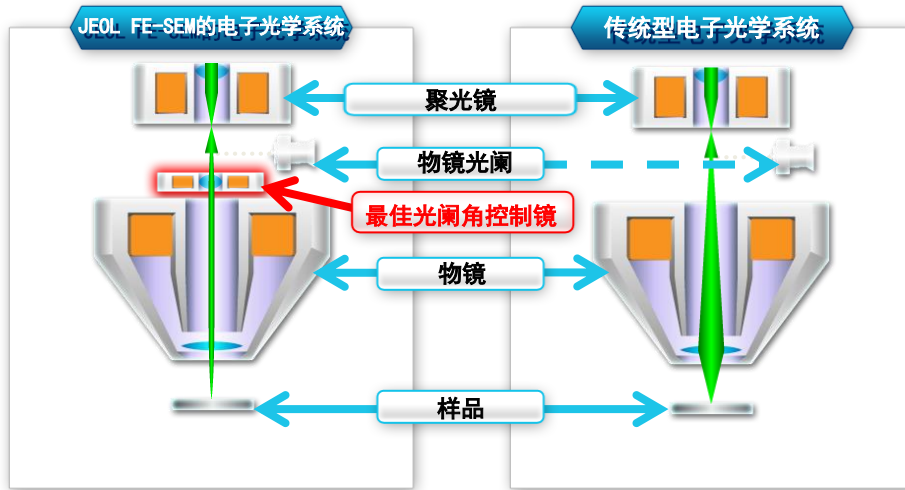


JEOL FE-SEM 采用最佳光阑角控制镜

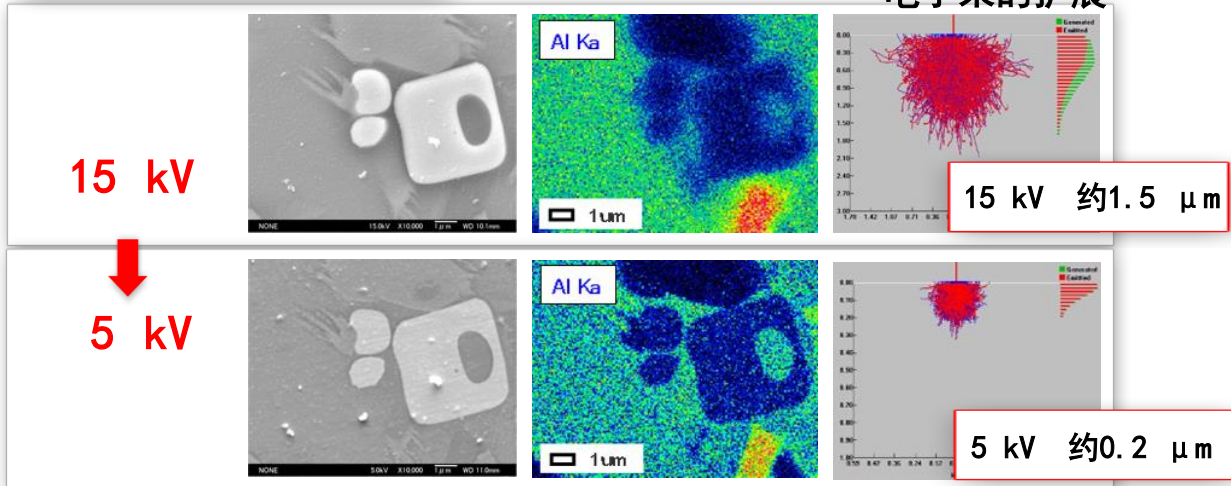
最新型的场发射扫描电镜JEOL FE-SEM采用了最佳光阑角控制镜，因此，即使在很大的探针电流下也能获得很小的电子束斑。此外，使用低加速电压进行元素分析，可以减小电子束在样品中的扩展区域，能进行高空间分辨率的微区分析。



探针电流增大时，通过光阑角控制镜能获得小的探针直径。

探针电流增大时，探针直径也变大。

样品：溶岩（三宅岛）



低加速电压下减少电子束在样品中的扩展，同时利用大探针电流进行快速分析。

能够在微区进行高空间分辨率的分析

产品规格如有变动，恕不另行通知。

本资料中登载的产品如果受到外汇及外国贸易法规的安全保障出口的限制，或者需要从日本携带出境时，请与本公司联系。

联系方式：日本电子株式会社电子光学仪器销售部 TEL: +81-3-6262-3567 FAX: +81-3-6262-3577

版权所有 (C) JEOL保留所有权利。